## امتحان ميانترم أزمون پذيري

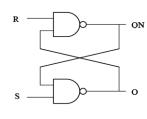
## باسمه تعالى



نیمسال اول ۹۰–۸۹

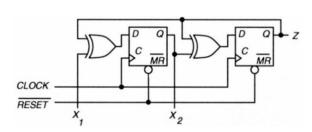
وقت امتحان: ۱۰۰ دقیقه

۳۰ نمره

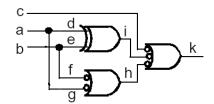


۱. برای S-R Latch مقابل و ورودی های داده شده، به ازای هر مدل تأخیر، با روش شبیه سازی مبتنی بر رویداد، مقادیر خروجی ها را رسم کنید.

 $d_{propagation} = 2, \, d_{inertial} = 2$  الف (۲ نمره) مدل تأخیر:  $d_{rise} = 1, \, d_{fall} = 3$  ب (۳ نمره) مدل تأخیر:  $d_{min} = 1, \, d_{Max} = 2$ 



7. ( $\beta$  نمره) با فرض سنکرون بودن سیگنال RESET مقادیر قابلیت کنترل و مشاهده ترکیبی و ترتیبی را برای مدار مقابل به دست آورید.  $X_1$  ورودی مدار، و  $X_2$  و  $X_2$  خروجیهای مدار هستند. (اگر به هیچ وجه قادر به حل ّایین مسأله نیستید، با صرف نظر کردن از سه نمره، سوال  $\beta$  را به جای آن حل کنید!)



۳. (۴ نمره) در مدار مقابل، اگر بردار ورودی 111 = abc به مدار داده شود، با روش شبیه سازی
استنتاجی چه اشکالهایی کشف می شود؟

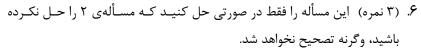
۴. شکل مقابل یک گیت NAND را نشان میدهد.

. الف (۲ نمره) ثابت کنید اشکالهای stuck-open در هر یک از دو ترانزیستور  $N_1$  و  $N_2$  معادلند

ب (۳ نمره) میخواهیم مدار را برای کلیّهی اشکالهای single stuck-open در ترانزیستورها و کلیّهی SSF ها در ورودیها و خروجی گیت تست کنیم. کمترین تعداد بردار تست لازم بـرای ایـن منظـور را پیـدا کنیـد. آیـا ترتیب مشخصی برای اعمال کردن این بردارها وجود دارد؟ چگونه؟

ج ( $^{\circ}$  نمره) برای هر یک از اشکال های single stuck-at در ورودی های  $^{\circ}$  و خروجی  $^{\circ}$  در صورت وجود داشتن، اشکال معادل در سطح ترانزیستوری (stuck-open, stuck-short) را بیان کنید. راهنمایی: ممکن است یک اشکال تکی، معادل یک اشکال چندگانه (multiple) باشد.

۵. (۵ نمره) برای یک TFF که دارای سیگنال reset آسنکرون active-high میباشد، مقادیر قابلیت کنترل و مشاهده ترکیبی و ترتیبی را به دست آورید (برای ورودیهای CLK ،R ،T و خروجی Q). یادآوری: در این FF، با رسیدن لبه ی CLK، اگر T=0 باشد خروجی معکوس مقدار قبلی میشود.
مقدار قبلی خود را حفظ می کند و اگر T=1 باشد، خروجی معکوس مقدار قبلی میشود.



مقادیر قابلیت کنترل و مشاهده ترکیبی را برای مدار مقابل به دست اَورید.

موفق باشید،

حسابي

